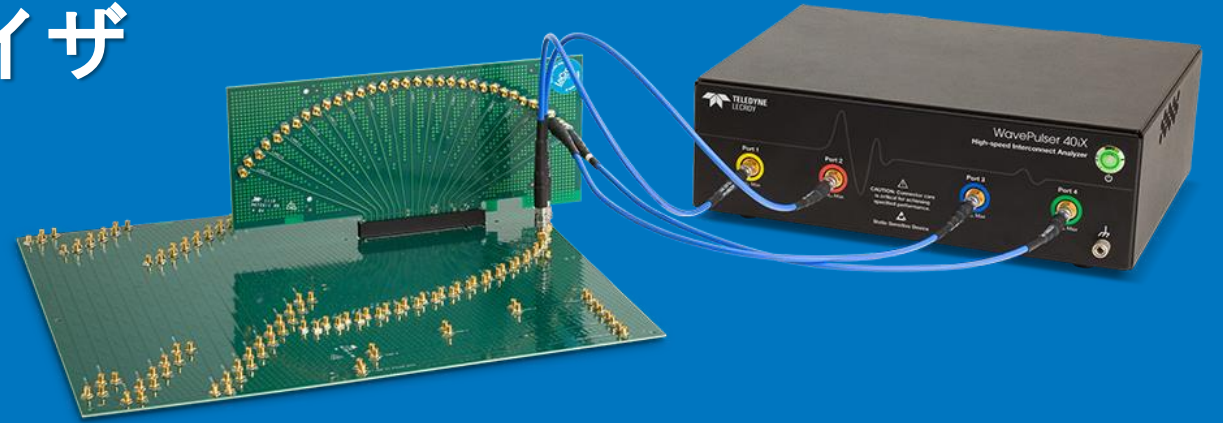


WavePulser 40iX

高速インターコネクト・アナライザ

アプリケーション・バージョン9.1.0.3 リリースノート

Giuseppe Leccia
Business Development Manager



TELEDYNE LECROY
Everywhereyoulook™



**Unmatched
Characterization
Insight**

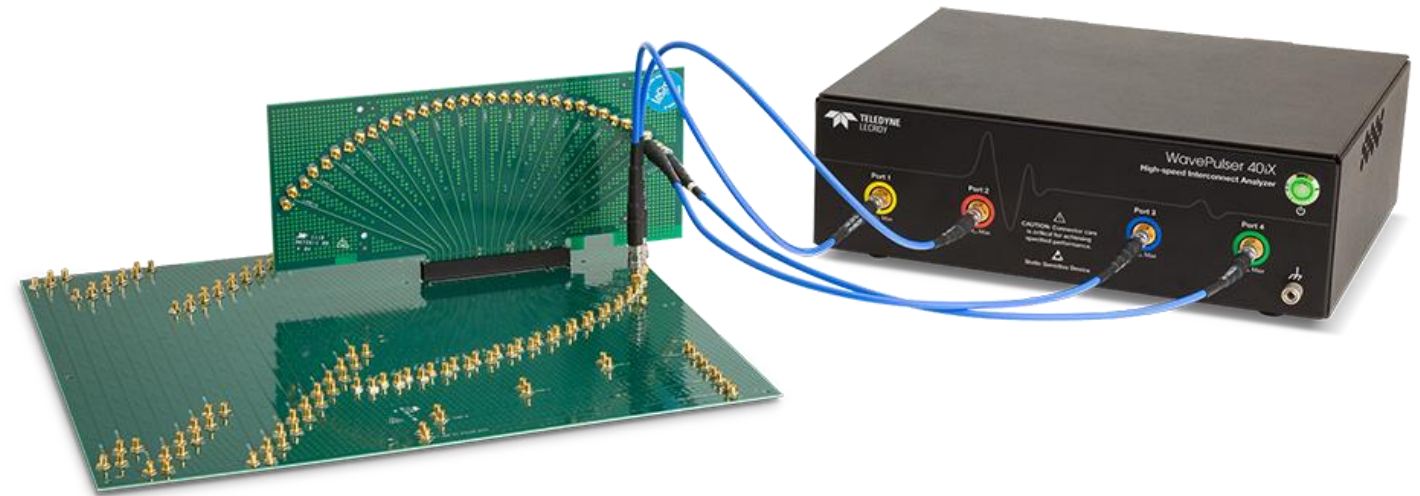
WavePulser 40iX リリースノート 9.1.0.3

アジェンダ

— What's new?

1. 新たなベースライン校正：低周波およびDCにおいて高精度結果を得るための自動校正手順のステップを追加
2. 工場校正を行うための新たなユーザー2nd tier校正：ユニットを工場に返送することなくユーザーが工場校正をすることが可能に
3. 新たにメモリトレースを12に増加

高速インターコネクト・アナライザ：
高速ハードウェア設計者、テスト・エンジニアにとって理想的単一ツール



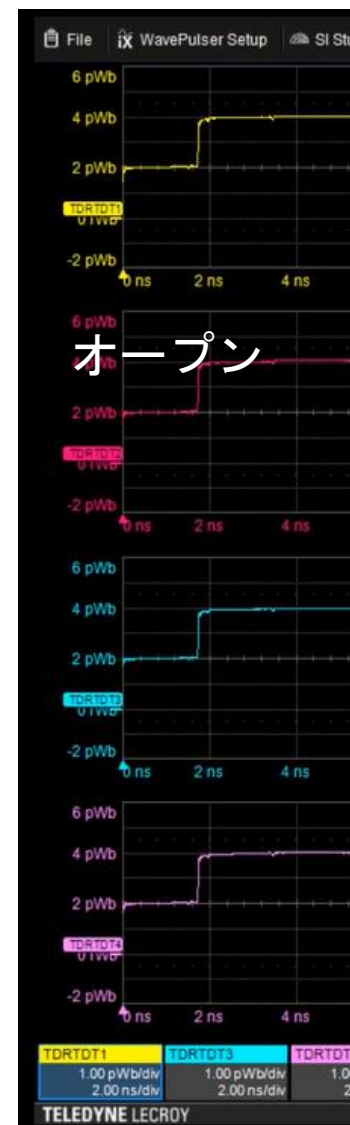
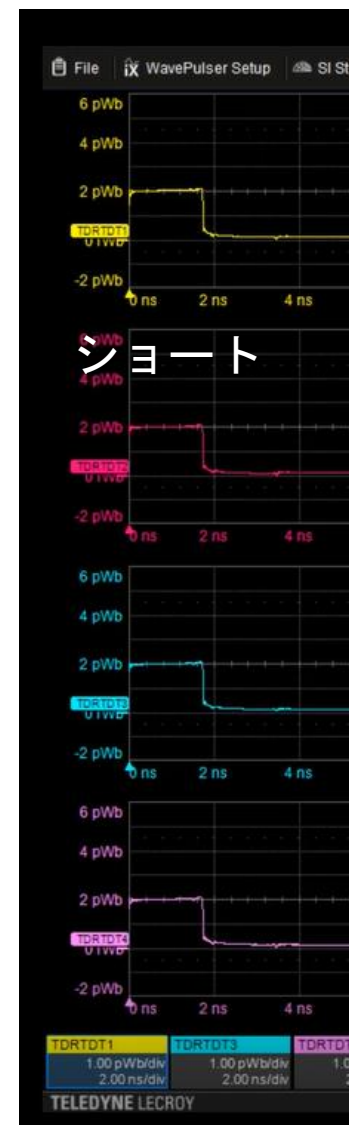
WavePulser40iX自動校正シーケンス(9.1.0.3)

自動内蔵校正

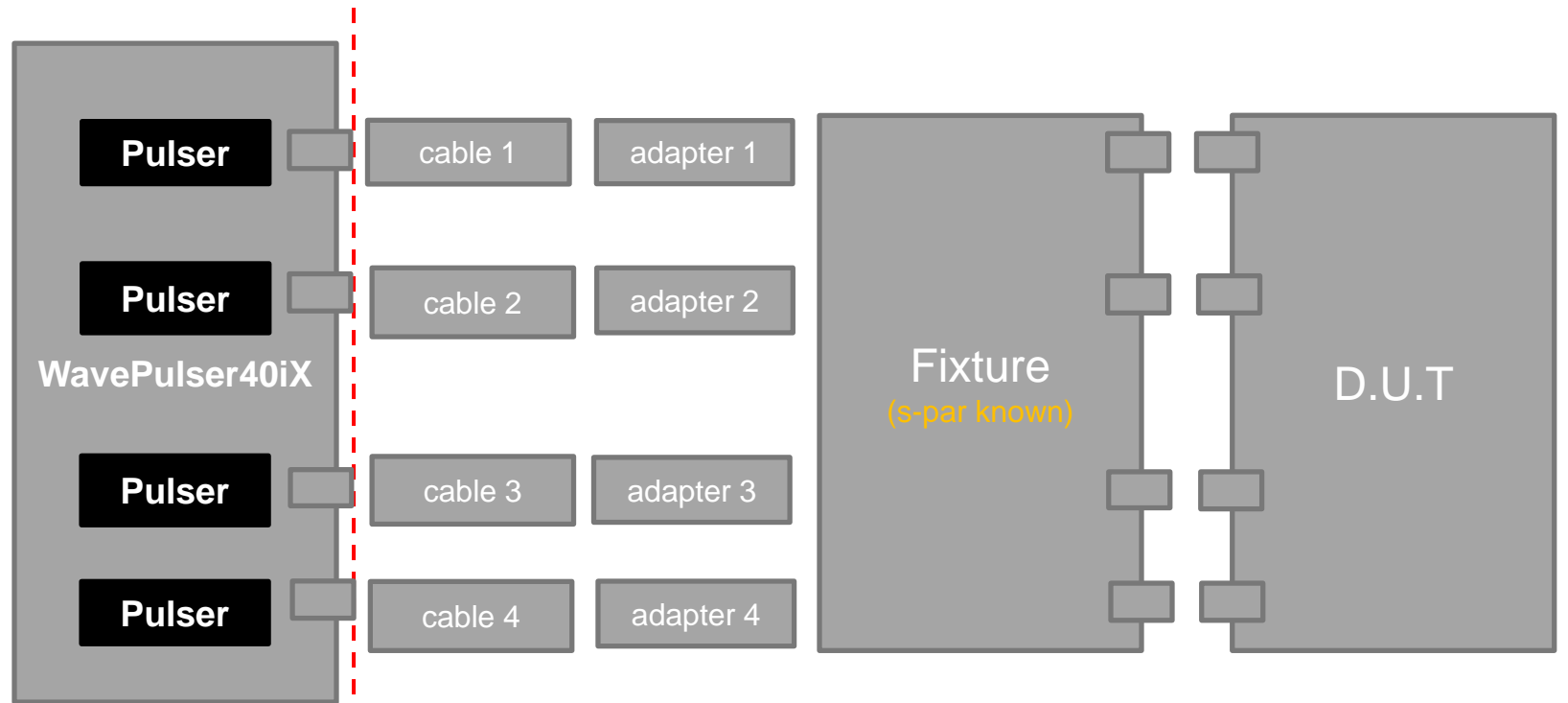
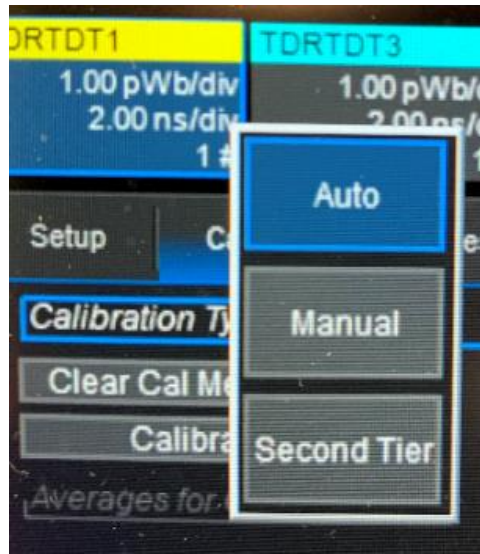
- DCから40GHzを即座に測定
- 手動校正は不要

低周波とDCにおける高精度な結果

- ベースライン校正



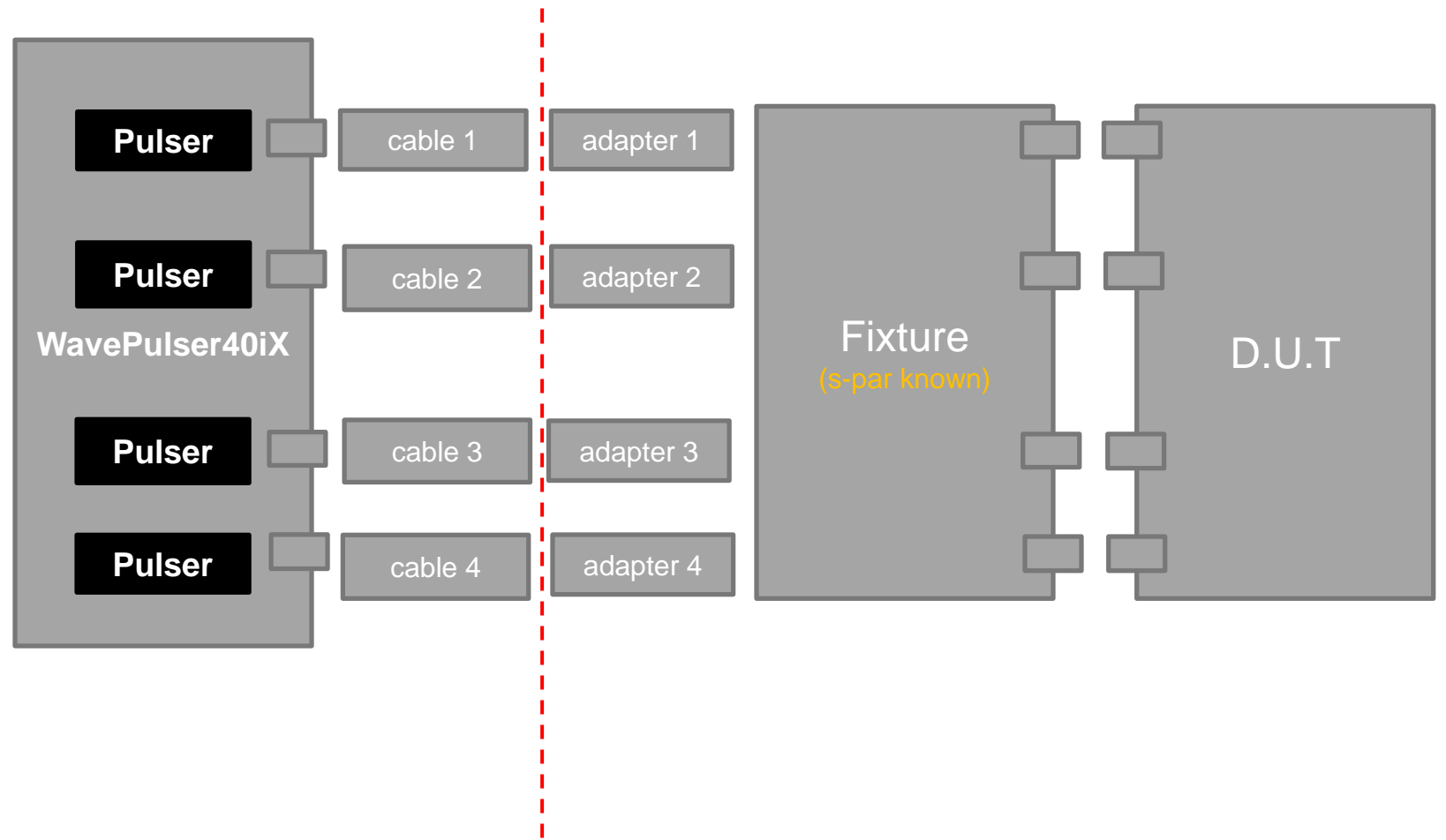
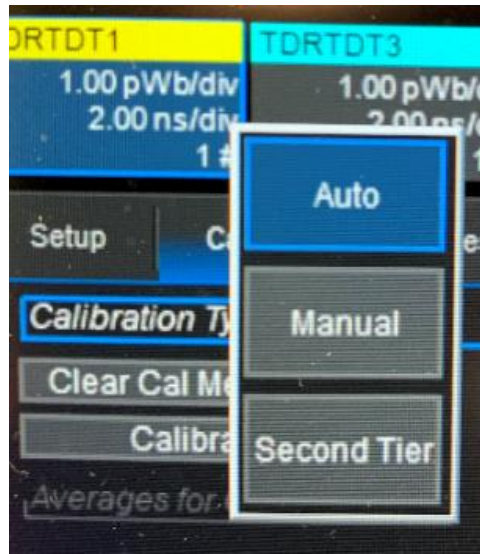
自動内蔵校正



自動内蔵校正：
瞬時に校正
DC~40 GHz

自動校正の
基準プレーン

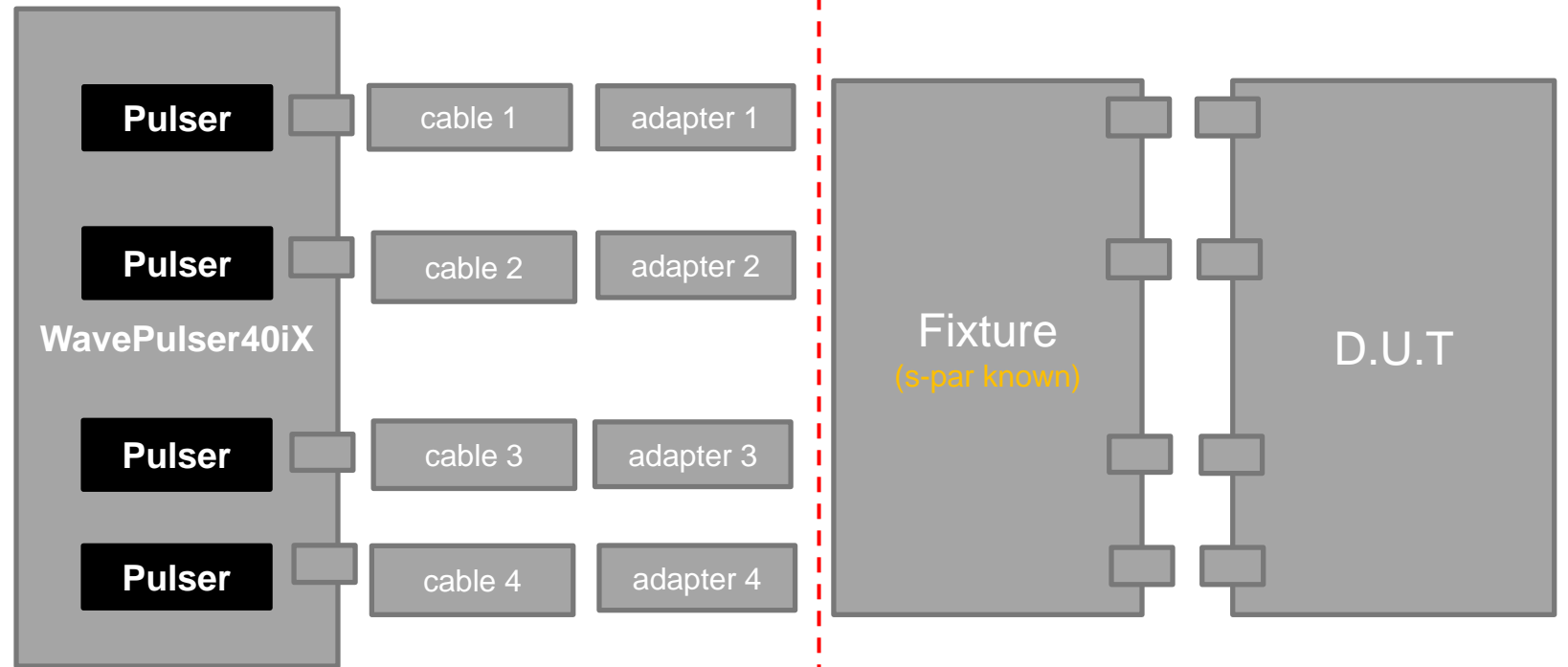
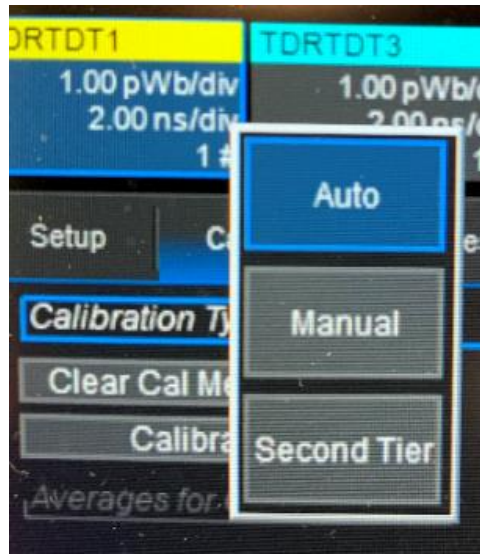
自動内蔵校正



自動内蔵校正：
瞬時に校正
DC~40 GHz

自動校正の
基準プレーン

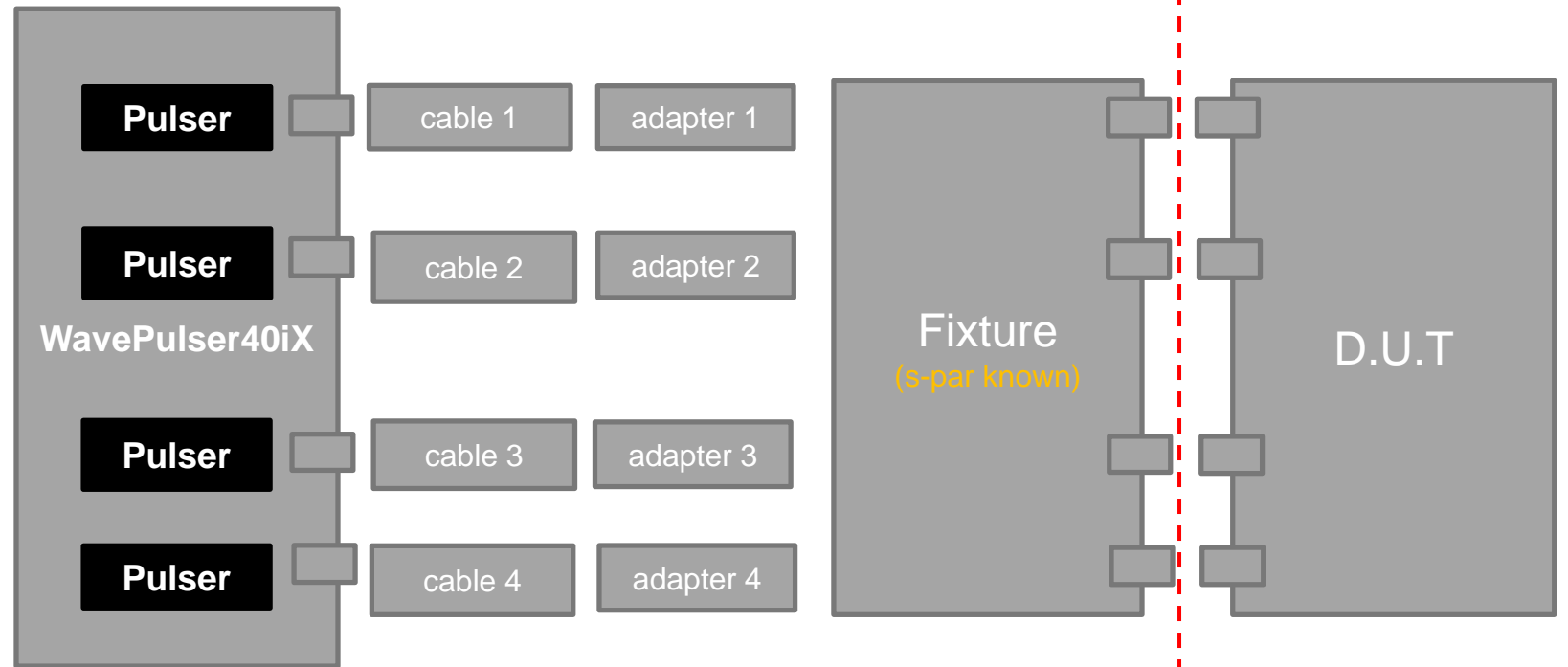
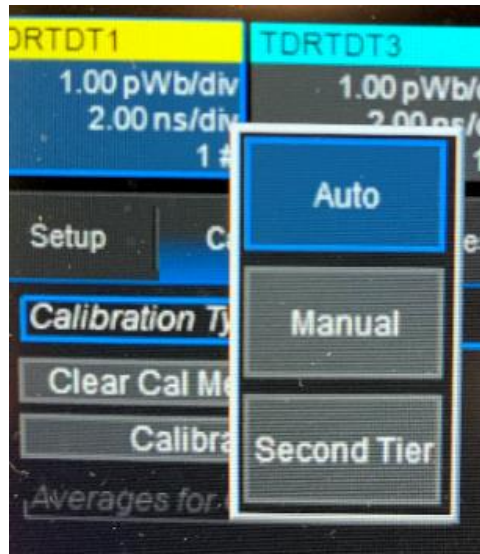
自動内蔵校正



自動内蔵校正：
瞬時に校正
DC~40 GHz

自動校正の
基準プレーン

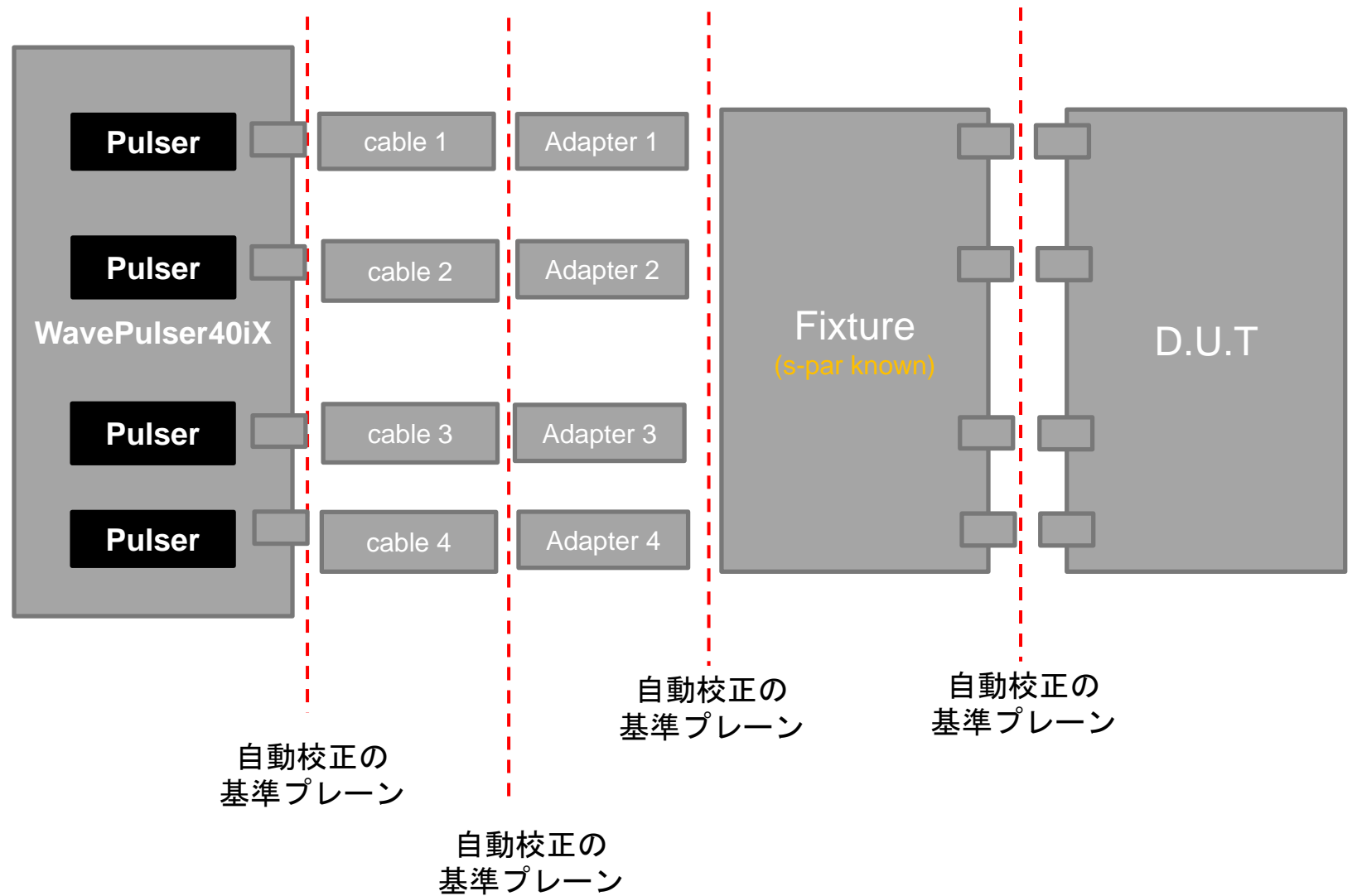
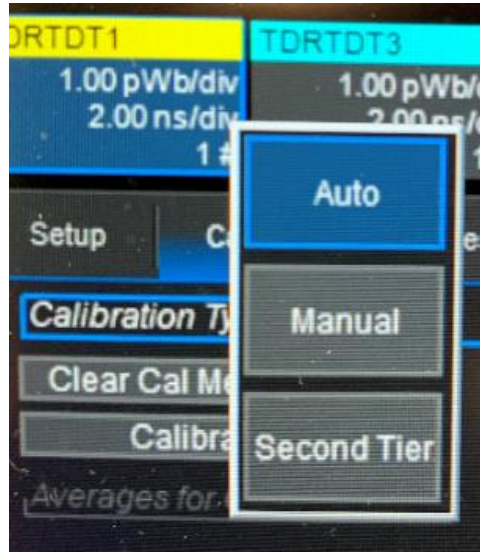
自動内蔵校正



自動内蔵校正：
瞬時に校正
DC~40 GHz

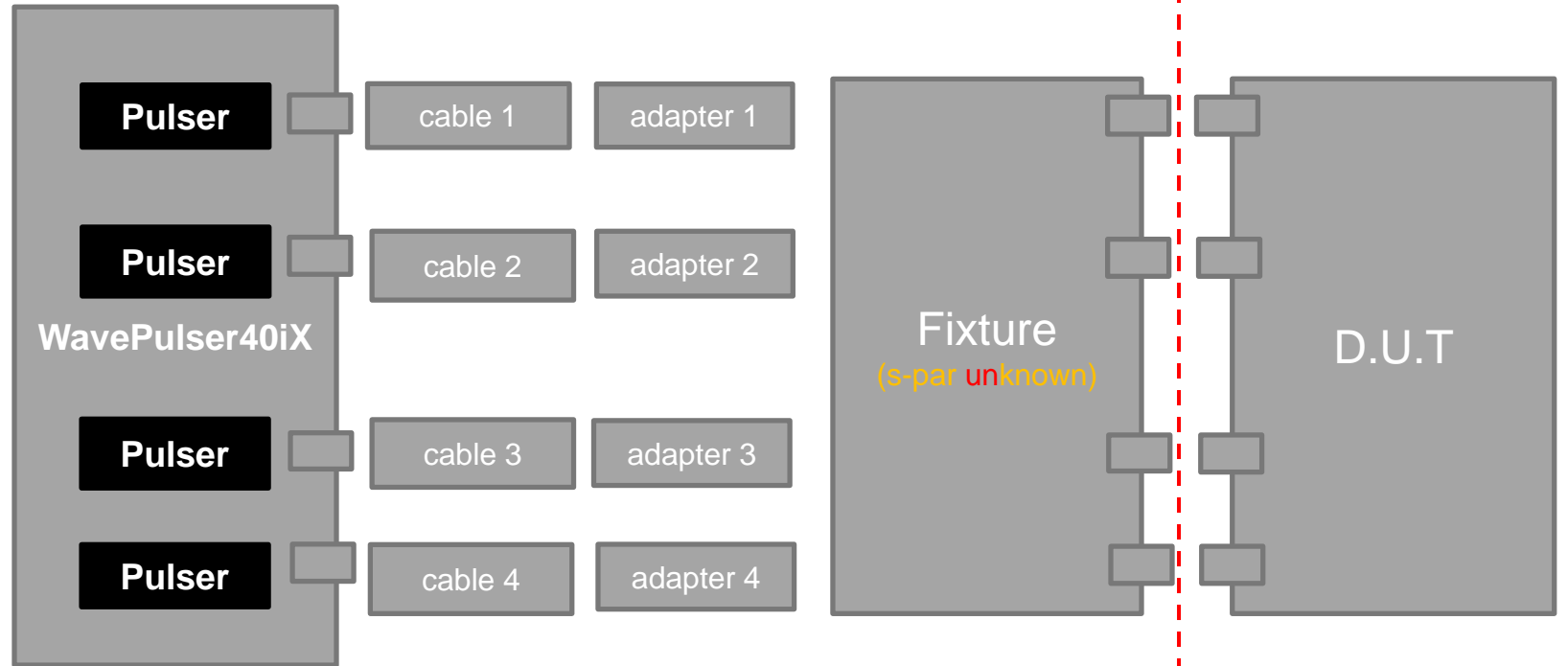
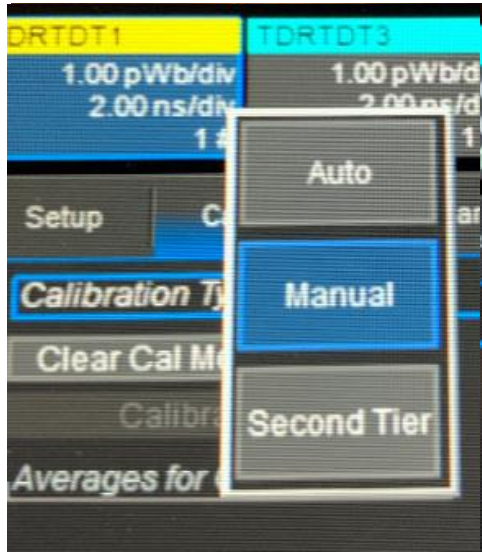
自動校正の
基準プレーン

自動内蔵校正



自動内蔵校正：
瞬時に校正
DC~40 GHz

手動校正



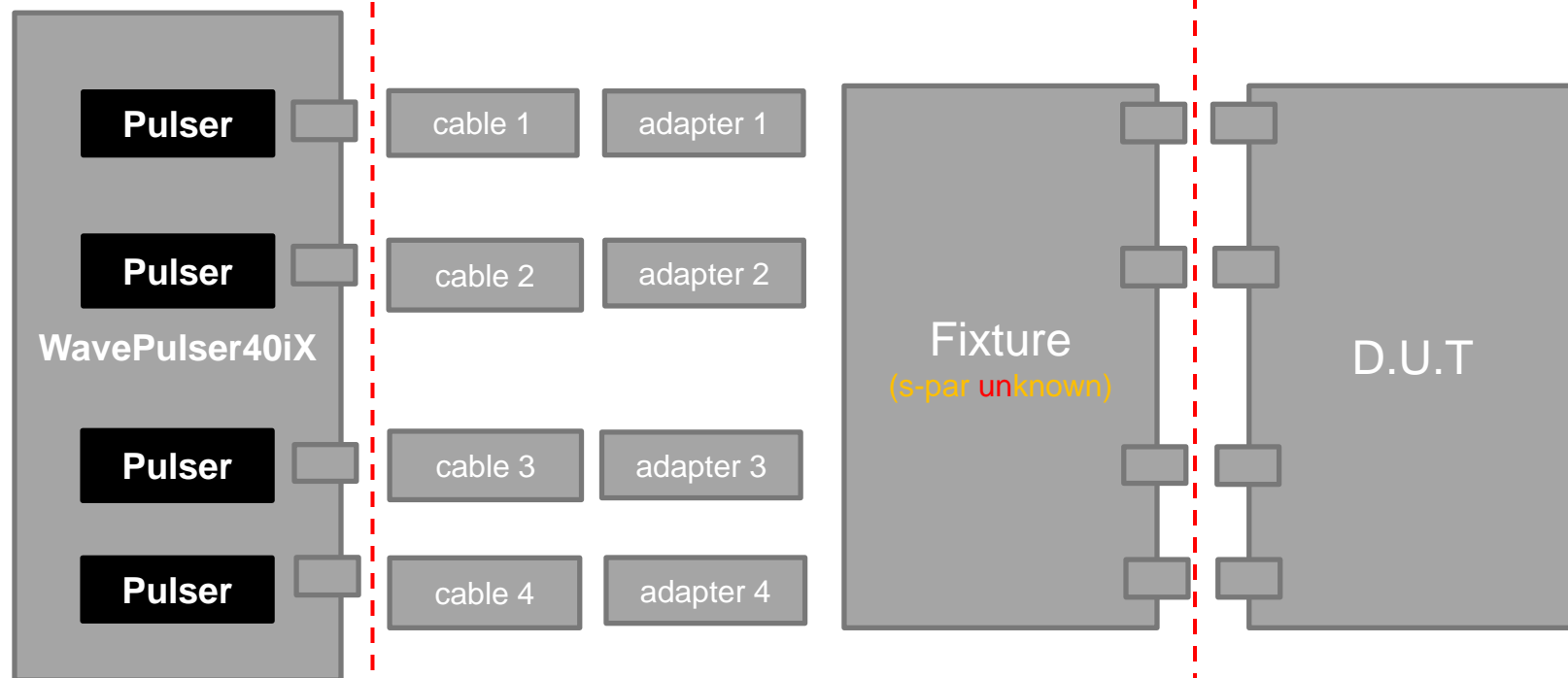
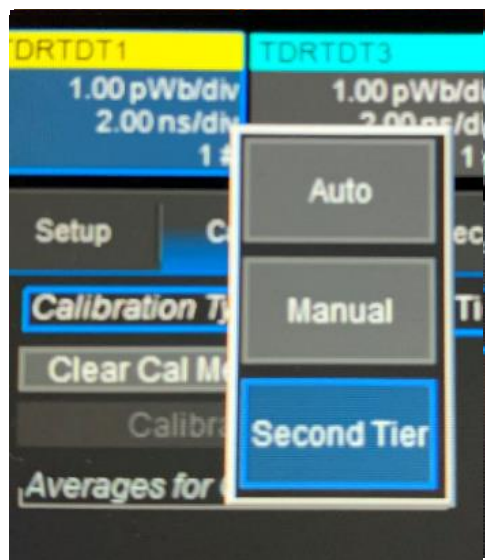
ユーザー定義基準プレーン
のためのマニュアル校正

Open-Short-Load-Thru
(OSLT)校正キット



手動校正の
基準プレーン

2nd-tier校正が可能になりました!



2nd Tier校正 :

手動校正と組み込みの内部校正を組み合わせる利点

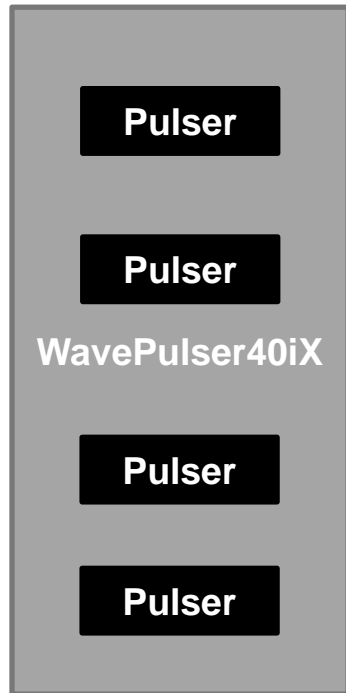
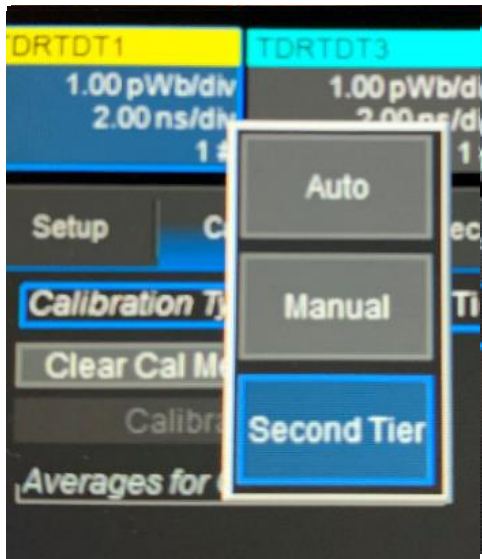
内部校正の
基準プレーン

Open-Short-Load-Thru
(OSLT)校正キット

手動校正の
基準プレーン



2nd Tier校正 : Factory CALの生成

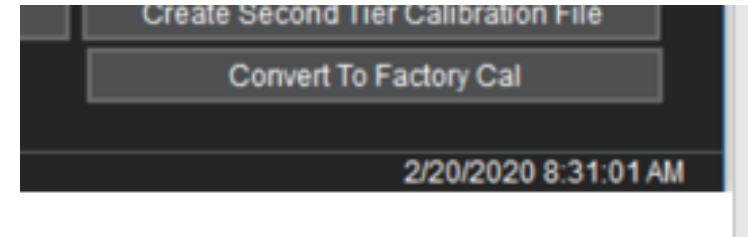


cable 1

cable 2

cable 3

cable 4



Open-Short-Load-Thru (OSLT)校正キット

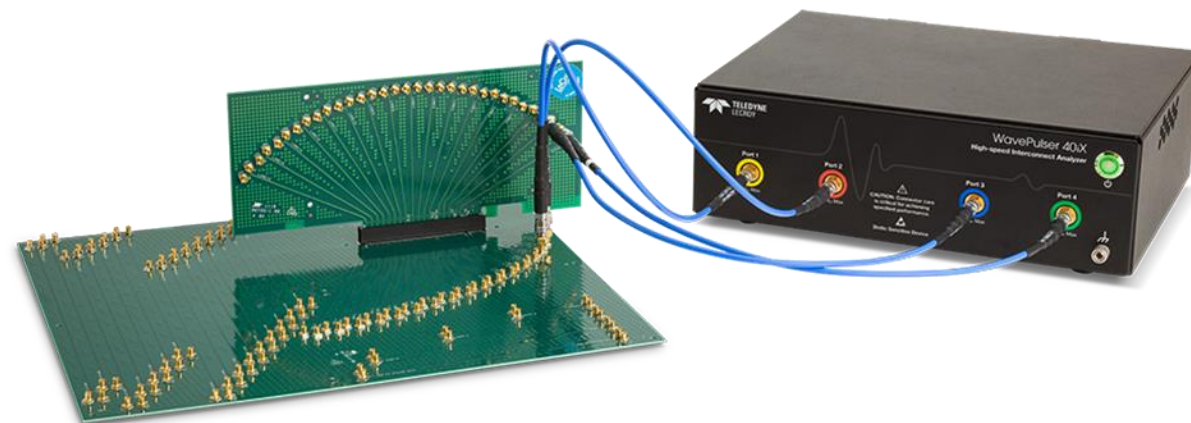
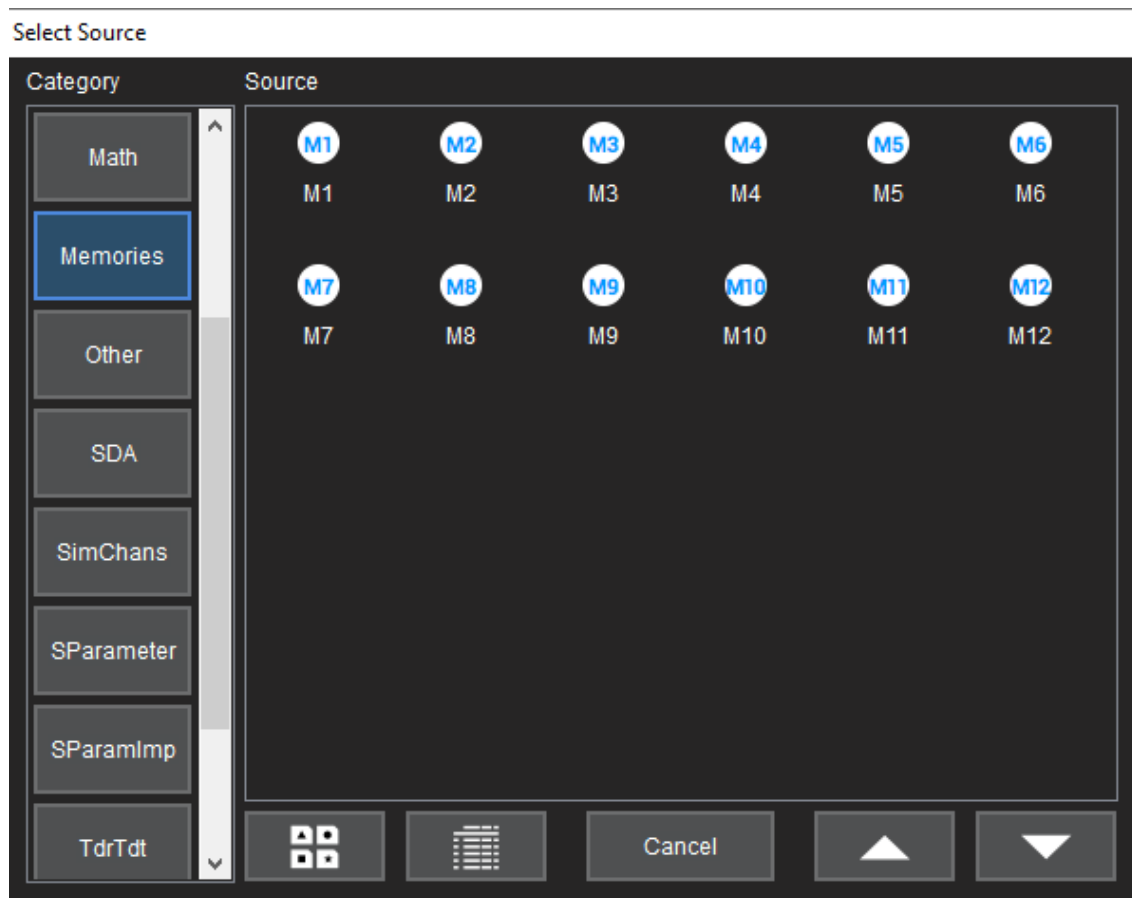


内部校正の
基準プレーン

2nd-tier校正の
基準プレーン

工場にユニットを返送
せずに可能なオンサイ
ト工場校正手順

メモリトレースが12に増加



ありがとうございました、引き続きご期待ください！